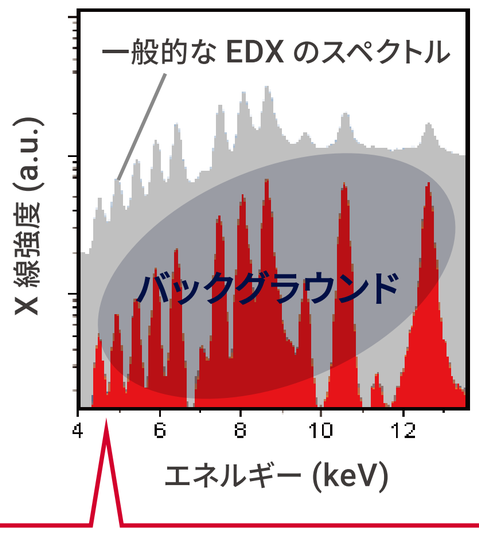
高感度X線分析の新時代

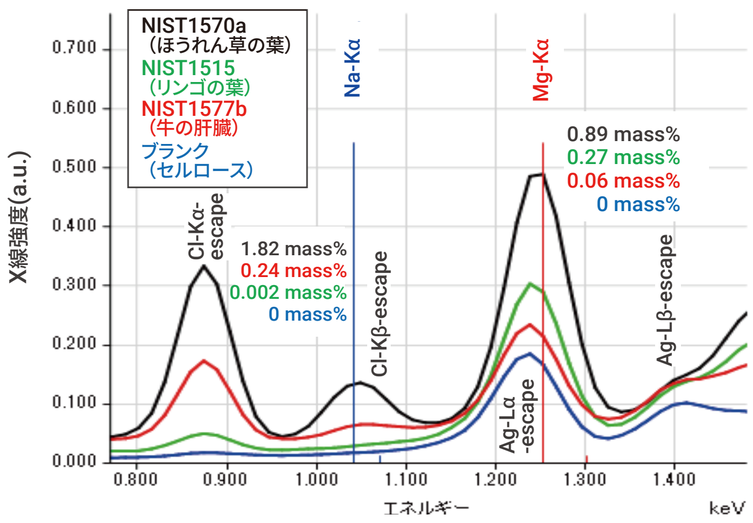
偏光光学系と高出力X線管で
医薬・化粧品のサブppm分析が可能

NEX CG II+

NEX CG II+　独自の技術



一般的なEDX（直接励起方式）

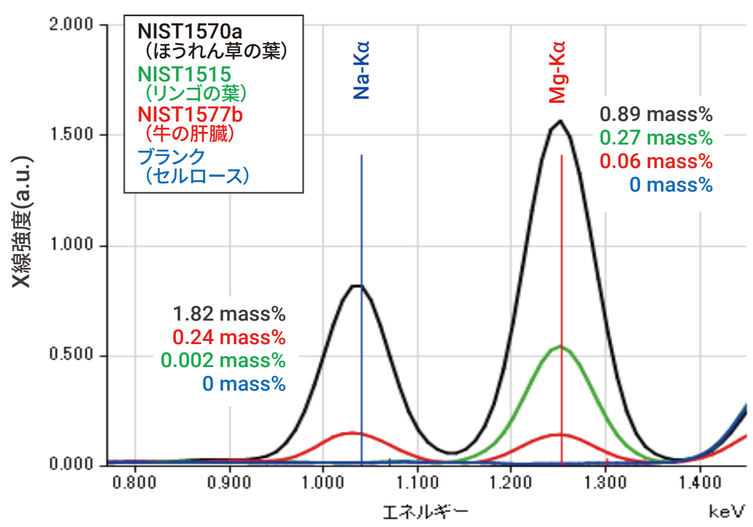


X 線管由来のエスケープピークが重なる
試料由来の Cl のエスケープピークが検出される

→ピークの重なりが発生、BG が平坦でない

偏光光学系（NEX CG II+）

※軽元素用ターゲットを使用



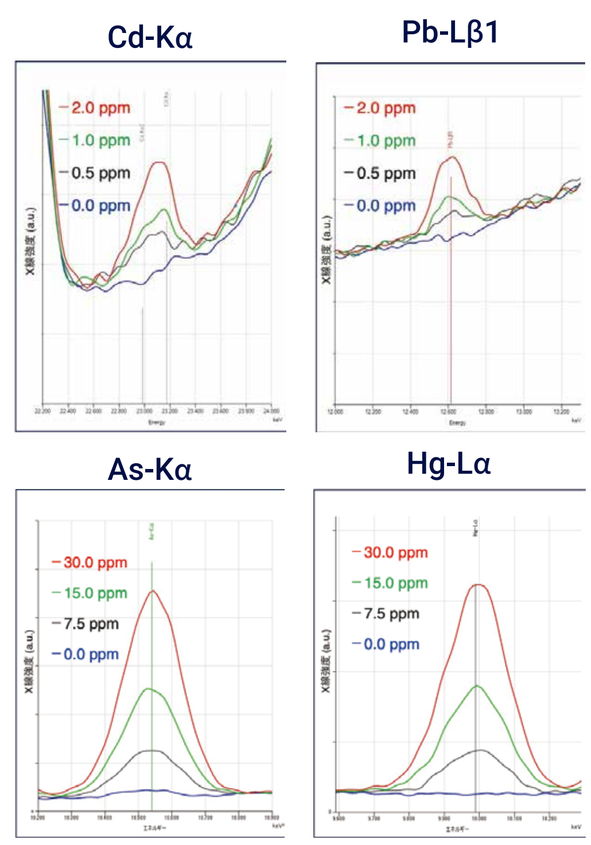
X 線管由来のエスケープピーク、試料由来の
Cl のエスケープピークのいずれも検出されない

→ピークの重なりがなく、BG が低く平坦
→SN 比が良好で、微量の Na、Mg が検出可能

医薬品の元素不純物ガイドライン (ICH Q3D) に対応

経口製剤における各元素不純物の許容一日曝露量 (PDE) と、NEX CG II+ の検出下限
(PDE : Permitted Daily Exposure)

元素	クラス	PDE 値 µg	一日の各投与量における許容濃度			NEX CG II+ 検出下限 µg/g (ppm)
			10 g 以下 µg/g (ppm)	5 g µg/g (ppm)	1 g µg/g (ppm)	
Cd	1	5	0.5	1	5	0.15
Pb	1	5	0.5	1	5	0.06
As	1	15	1.5	3	15	0.04
Hg	1	30	3	6	30	0.09
Co	2A	50	5	10	50	0.08
V	2A	100	10	20	100	0.10
Ni	2A	200	20	40	200	0.20



装置：NEX CG II+
測定時間 ： 600秒
マトリックス：セルロース

Rigaku

rigaku.com

© Rigaku Holdings Corporation and its Global Subsidiaries. All rights reserved.